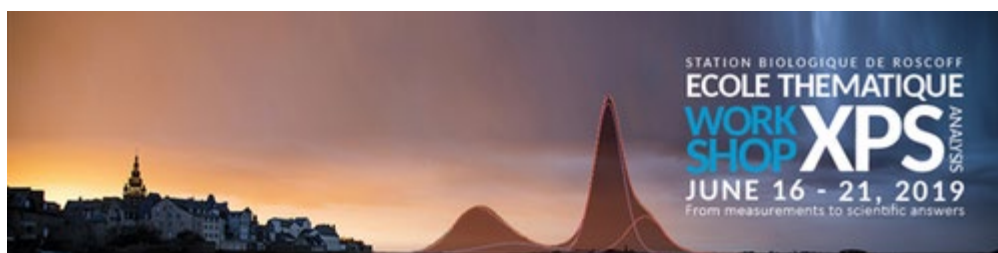


## FLASH INFO

Division Spectroscopies d'Électrons

### FLASH INFO N°1 – JUILLET 2019

#### XPS DATA INTERPERTATION: FROM MEASUREMENTS TO SCIENTIFIC RESULTS



L'école thématique dédiée à l'analyse de données XPS a été organisée par l'Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) du 16 au 21 juin à la station biologique de Roscoff. Elle a réuni 54 personnes en provenance de 4 continents, 14 pays dont 11 étudiants et post-doctorants, 6 industriels, un éditeur et 17 agents CNRS. Le jury composé de Mark Biesinger, Emily Smith et Jocelyne Leroy a décerné le prix « Poster jeune chercheur-e de La société Française du Vide » à Justine Voronkoff de l'unité mixte de recherches CNRS/Saint-Gobain à Aubervilliers.

La prochaine édition est prévue en 2022. Si vous souhaitez en être informé, envoyez-nous un e-mail à : [etxps@cncrs-imn.fr](mailto:etxps@cncrs-imn.fr)

Catherine Guillot-Deudon, Vincent Fernandez et Mireille Richard-Plouet, IMN.

#### JSE 2020 - Journées de Spectroscopies d'Electrons Paris, Campus de Jussieu



#### La prochaine édition des JSE aura lieu les 21 et 22 Janvier 2020.

Le Focus Thématique sera dédié aux mesures in-situ et operando : Near-Ambient Pressure XPS, mesures sous illumination, électrochimie in-situ, dispositifs polarisés in-situ, .... Une liste des orateurs Keynote sera disponible d'ici mi-septembre sur le site habituel : [www.jse-surfaces.org](http://www.jse-surfaces.org)

---

Toutes les informations et actualités de la Division Spectroscopie d'Electrons sont disponible ici : <https://www.vide.org/sfv/divisions/spectroscopie-electrons/>. Un recensement des spectromètres disponibles en France est désormais en ligne à la page « Sous-comités régionaux ».

---